#### 物理学会2008年年次大会近畿大 25pRE-8

# RT-1におけるプラズマ中の 空間電位計測と流れ駆動実験

東大新領域,高温プラズマ研究センター 齋藤晴彦,吉田善章,小川雄一,森川惇二,渡邉将,矢野善久,鈴木順子,林裕之

- 目次 1. 研究の背景と概要
  - 2. 磁気圏型プラズマ実験装置RT-1
  - 3. 2.45GHz及び8.2GHz ECHによるプラズマの高性能化
  - 4. まとめと今後の課題





#### 研究背景と本研究の概要

- □ RT-1では、電場形成実験に先立ちコイル磁気浮上状態でのプラズマの 高性能化を目指す研究を進めている. 従来より行ってきた8.2GHzに加え, 2.45GHz 20kWマイクロ波によるプラズマ生成実験を開始した.
- 8.2GHzでは、2930Gの共鳴面が内部導体コイルを横切る位置関係にあり、この時放電中に硬X線が発生し、プラズマパラメータは比較的低密度、低β(線平均密度は3×10<sup>17</sup>m<sup>-3</sup>、反磁性信号600μWb)に留まっている.
- □ 本研究で使用した2.45GHzでは, 共鳴層が磁場コイルから分離して存在 しており, より効果的なバルクプラズマ生成が期待される.

□ RT-1において磁気浮上状態でプラズマの密度, 温度上昇を目的とした実験 を行い, その際のプラズマパラメータのSi(Li), 干渉計による評価を行った.

□ 比較的低温低密度のプラズマ中で電極によるバイアス実験を開始した.

## 磁気圏型閉じ込め装置RT-1 (Ring Trap-1)\*



#### <u>Ring Trap 1 (RT1) 装置の断面図</u>

高温超電導コイル 115A (250kAT) Bi-2223 吊上げコイル (最大定格90kAT) による制御浮上.

- \* Z. Yoshida et al., Plasma Fusion Res. **1**, 008 (2006).
- \*\* S. M. Mahajan, Z. Yoshida, PRL 81, 4863 (1998).
   Z. Yoshida, S. M. Mahajan, PRL 88, 095001 (2002).

### RT-1の外観とプラズマ生成・計測システム



#### 8.2GHz RFによるプラズマ生成



<u>8.2GHz ECHプラズマ放電の典型波形</u>

□ 反磁性信号の立ち上がりに合わせて 可視光強度が減衰し,軟X線強度が増大.

- □ 主に高エネルギー電子成分がマイクロ波 の停止後に長時間の閉じ込めを示す (粒子閉じ込め時定数は0.3s程度).
- □コイル磁気浮上により電子線密度が2倍 程度まで増大するが、現在の入射パワー ではO-mode cut off密度に達しない. また、 特に低ガス圧領域で硬X線の発生により、 SX計測が困難.



### 2.45GHz RFによるプラズマ生成



<u>2.45GHz ECHプラズマ放電の典型波形</u>

- □ 反磁性信号の立ち上がり時に可視光強度 及び電子密度が減衰し,同入カパワーに 対して~mWbの反磁性信号が得られる.
- □コイル磁気浮上時に電子線密度が2倍 程度まで増大し、平均密度でO-mode cut off密度を上回る. EBWの効果を示唆.
- マイクロ波エネルギーが効率的にプラズマに吸収され、~MeV電子成分でなく、βに寄与出来る軟X線領域の電子が存在する事を示している.



# コイル浮上の効果と電子温度(2.45GHz RF)





#### <u>高エネルギー成分の電子温度</u>

□ 2.45GHz ECHプラズマの高エネルギー成分 電子温度を内側ポート(r=62cm)で測定した.

 □ 光子カウントから見積もった電子成分は 5keV, ~10<sup>16</sup>m<sup>-3</sup>であり, β値にほぼ等しい.
 ⇒ 高エネルギー成分がプラズマ圧力の主体.

□コイル磁気浮上時に、ステンレス由来の 金属輝線が著しく増大する(低パワー時も).

□コイル支持状態で飽和する電子温度が
 磁気浮上時に飽和しない(βの傾向と一致).

□ 8.2GHz実験での電子温度計測は今後の
 課題(硬X線及びpile up対策).

#### 8.2GHz/2.45GHz実験の傾向(磁気浮上の効果を含む)



実験日が異なるショット群であり,放電を続ける事により プラズマ性能が徐々に改善する傾向を示している.

#### 8.2GHz及び2.45GHzの同時入射



各ショットはいずれも磁気浮上時のデータ.

#### まとめと今後の課題

- RT-1において8.2GHz 25kW及び2.45GHz 20kWマイクロ波によるECH プラズマ実験を行い、高いβが得られる2.45GHzと高密度が得られる 8.2GHzを併用する事で、2.45GHz cut off密度を超える線平均電子密度 を有し、かつ数十%の局所βを持つプラズマを生成した。
- □ ECHにより温度~10keV, バルクの10%程度の成分の高エネルギー電子が
   生成され主としてプラズマのβを担っている(2.45GHz放電時のSi(Li)計測).
- □ 8.2GHz実験時にSi(Li)計測にノイズ対策が必要となっており、上記の際の電子温度計測とβ値との比較は今後の課題である.
- □ 比較的低温低密度のプラズマ中で電極によるバイアス実験を開始しており、
   今後は詳細な流れ分布と径方向電流分布の計測実験を実施する計画.



$$E + v \times B - \frac{1}{en_i} \nabla p_i = \eta \mathbf{j}$$

$$n_i e \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{j} \times B - \nabla \cdot \mathbf{\Pi} - \nabla (p_i + p_e) - m_i n_i v_{in} \mathbf{v}$$

$$E_r - \frac{1}{en_i} \frac{dp_i}{dr} = \frac{j_r B_z^2}{m_i n_i v_{in}} + \frac{B_z}{m_i n_i v_{in}} (\nabla \cdot \mathbf{\Pi}) \cdot \hat{\mathbf{\theta}} + \eta \mathbf{j}$$